文章编号:0253-2239(2010)02-0597-05

红外短波/长波分色片的研究

章岳光 王 颖 孙雪铮 沈伟东 刘 旭 顾培夫 (浙江大学现代光学仪器国家重点实验室,浙江杭州 310027)

摘要 短波红外/长波红外分色片在红外双波段成像光学系统中起着重要的作用。分析了分色片基板和薄膜材料的选择。选定硒化锌为基板,采用 Ge,ZnSe 和 YbF。作为薄膜材料进行了优化设计,并对沉积温度和蒸发速率等 工艺条件进行了优化,用电子束蒸发方法制备了该分色片,其反射率和透射率都达到了 93%以上,已成功应用于实际光学系统中。

关键词 薄膜光学;分色片;硒化锌基板;红外双波段成像光学系统 中图分类号 TB443 **文献标识码** A **doi**: 10.3788/AOS20103002.0597

Design and Fabrication of Short-Wave /Long-Wave Infrared Dichroic Beam Splitter

Zhang Yueguang Wang Ying Sun Xuezheng Shen Weidong Liu Xu Gu Peifu (State Key Laboratory of Modern Optical Instrumentation, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang 310027, China)

Abstract Short-wave /long-wave infrared dichroic beam splitters take an important role in two-band infrared imaging optical systems. The choice of substrate and coating materials are discussed. Ge, ZnSe and YbF₃ were chosen as film materials and ZnSe as substrate; The coating reflecting the shortwave infrared light while transmiting the longwave infrared ($8 \sim 12 \ \mu m$) light is analyzed, and the beam splitter is manufactured by electronic-beam evaporation. The measured reflectivity and transmittance of corresponding band are all above 93%. Such dichroic beam splitters have been successfully applied to the actual optical system.

Key words optical thin film; dichroic beam splitter; ZnSe substrate; two-band infrared imaging system

1 引 言

随着光电武器系统的发展,红外热像仪被广泛 装备在军事领域中。同时,军事侦察要求红外成像 仪具有更远的作用距离、更高的图像分辨率、更强的 环境和气候适应性。在新型红外成像技术^[1,2]的研 发上,传统的单波段红外成像正在向多光谱红外成 像、超光谱红外成像和双色偏振红外成像发展。上 述新型的红外成像技术要求光学系统同时可以探测 多个光谱段的信息,而分色片可把入射光束分别导 向不同波段对应的探测器,因此在红外热像仪中有 着广泛的应用。短波红外/长波红外分色片就是其 中的一种。

2 原理与设计

2.1 原理

短波/长波红外双波段成像系统的光学系统原 理如图1所示,入射辐射经全反射卡塞格林系统后, 入射到与系统光轴成45°角放置的短波红外/长波 红外分色片,透射长波红外(8.0~12.0 μm)波段的 辐射,反射短波红外(1.0~2.5 μm)波段的辐射,实 现长波红外辐射和短波红外辐射的分离,经聚焦后 到相应辐射波段的探测器上,实现长波红外波段和 短波红外波段双波段成像。

根据光学系统的要求,分色片的具体指标如下 (其中 Tave与 Rave分别表示平均透射率与平均反射

收稿日期: 2009-02-19; 收到修改稿日期: 2009-04-17

基金项目:国家自然科学基金(60778025)和浙江大学国防预研基金资助课题。

作者简介:章岳光(1968—),男,副研究员,主要从事光学与光电子薄膜等方面的研究。

率,45°测量):

短波红外(1.0~2.3 μ m)反射率 $R_{ave} \ge 95\%$;长 波红外(8.0~12.0 μ m)透射率 $T_{ave} \ge 90\%$;或者透 射波段与反射波段反过来。





2.2 设计

2.2.1 分色片的选择

对于短波红外/长波红外分色片,可以选择反射 短波红外,透射长波红外的长波通方式,也可以选择 反射长波红外,透射短波红外的短波通方式。对于 前者,基板的选择主要考虑长波红外高透即可,因此 可以选择锗(Ge),硫化锌(ZnS)或硒化锌(ZnSe);对 于后者,选择短波红外有尽量高透射率的基底材料, 如红外石英,ZnSe等就可以满足要求,这里采用 ZnSe为基板材料。8.0~12.0 μm 区的反射薄膜, 如果选择介质薄膜,则薄膜厚度会很厚,若采用金属 介质诱导薄膜^[3],虽然薄膜厚度可以减薄,但含有金 属银的膜系环境稳定性差,易发生破裂脱落,另外在 短波红外区的诱导增透效果也不够好。相对的长波 通方式的厚度可以减少很多,综合考虑,决定采用长 波通叠加的方式。

2.2.2 薄膜材料的选择

在短波红外和长波红外同时高透的材料不多, 高折射材料可以选择 ZnS或 ZnSe,低折射率材料主 要是氟化物。ZnS和 ZnSe 是两种很成熟的薄膜材 料,ZnSe 有较高的折射率。Ge 在 1.7 μ m 以下有明 显吸收,但在 1.7 μ m 以上直至长波红外均有良好 的光机性能。常用的低折射率氟化物有氟化钇 (YF₃)、氟化钡(BaF₂)、氟化钍(ThF₂)和氟化镱 (YbF₃)等,其中 ThF₂ 虽然光机性能优良,却有放 射性;YF₃ 在长波红外大于 11 μ m 后有较大的吸 收^[4~6];BaF₂ 薄膜的表面粗糙度比较大,在薄膜较 厚时会在短波长处产生很大的散射;而 YbF₃ 材料 不但在可见至红外波段基本无吸收,还同时具有优 良的机械性能^[7],因此最终选择 ZnS,ZnSe 和 YbF₃ 作为薄膜材料进行初始设计。

2.2.3 膜系设计

文献中有关红外不同光谱区分色片的报道不 多,主要集中在研制中波红外和长波红外分色片^[8], 通常采用长波通的方法设计,但没有给出实验结果; 另外还有可见/长波红外的分色片^[9],也是采用长波 通设计,由于使用了吸收型高折射率膜料硅(Si),因 此薄膜在 400~600 nm 的反射很低。但对短波红 外和长波红外进行分束的分色片尚未见文献报道。

由于该分色片的工作波段较宽,在进行膜系设 计前需要知道薄膜材料在近红外到长波红外区的光 学常数。通过在 K9 基板和 ZnSe 基板上沉积薄膜, 分别测其透射率和反射率,采用包络线法求得相应 波段的光学常数。设计的重点是在保证光学特性的 基础上,如何减小薄膜的总厚度,既减少制备难度, 提高薄膜的使用寿命,又可以保持基板面形,而且可 以降低吸收和散射损耗。

ZnSe 和 YbF。在短波红外区均有良好的光机 性能,因此以这两种材料作为高低折射率材料配对 来设计分色片。由于折射率比太小,反射带要覆盖 1.0~2.3 μm 区域,必须四对以上的长波通叠加,膜 层数多达 50 层以上,膜层厚度超过 15 μm,理论平 均反射率在 97%以上。但实际制备时会有较多的 困难,而且层数太多,厚度太厚引起的制备误差和吸 收散射损耗将大大增加。而 Ge 跟 YbF。配对则有 很大的折射率比,其反射带宽度为^[10]

$$\Delta g = \frac{2}{\pi} \arcsin\left(\frac{n_{\rm H} - n_{\rm L}}{n_{\rm H} + n_{\rm L}}\right),\tag{1}$$

式中 $n_{\rm H}$ 和 $n_{\rm L}$ 分别为高、低折射率材料的折射率。 由 Ge/YbF₃组合的折射率可知, Δg 可达 0.3,远比 ZnSe/YbF₃组合的 0.14要大,而且每个反射对的 厚度可以大大减薄。因此可以采用 Ge/YbF₃配对 设计针对 1.7~2.5 μ m 的反射膜。而 1.0~1.7 μ m 的波段仍然采用 ZnSe/YbF₃反射膜对。

因此膜系设计时把反射 1.7~2.5 μm 波长的 Ge/YbF₃ 反射膜堆放在靠近基板侧,同时把反射 1.0~1.7 μm 波段的 ZnSe/YbF₃ 膜对放在靠近空 气侧,同时为增加薄膜的牢固度,最外层用 ZnS 材 料作为保护层,即初始膜系为

 $S \mid 0.95(0.5HL0.5H)^3 \ 0.63(0.5ML0.5M)^4$

0.5(0.5ML0.5M) 4 | Air,

其中 H,M,L 分别代表光学厚度为四分之一波长的 Ge,ZnSe,和 YbF₃,S表示基板侧。最后用商用薄

膜软件作厚度优化即可。

图 2(a)和图 2(b)分别是短波红外及长波红外 的设计透射和反射光谱,需要说明的是,设计时要把 薄膜材料的色散考虑在内,这时膜层数减少为 17 层,厚度减小到 3.4 μm。作为对比,表 1 列出了几 种不同材料搭配设计的初始结构,优化后的总厚度 及其光学特性。虽然第一种设计的设计反射率相对 较低,但考虑其厚度和制备难易情况,仍不失为一种 较佳的设计。尽管 Ge 薄膜在 1.7 μ m 以下有较大 的吸收,分色片在 1.0~2.3 μ m 仍有较高的反射 率,平均反射率为 96.5%。



图 2 短波红外及长波红外的设计透射和反射光谱

Fig. 2 Calculation spectrum of the beam splitter for short-wave infrared region and long-wave infrared region 表 1 设计膜系的特性对比

Table 1 Performance comparison of designed multilayer thin films

Coating material	Start design	Total thickness	Rave / %	Tave / %
		/nm	$(1.0 \sim 2.3 \ \mu m)$	$(8.0 \sim 12.0 \ \mu m)$
${ m Ge/YbF_3/ZnSe}$	(0.5ML0.5M) ⁴ 0.5(0.5HL0.5H) ⁴	3400	96.4	98.0
Ge/ZnS/ZnSe/	(0.5MN0.5M) ⁵ 0.72(0.5HL0.5H) ⁸ 0.54(0.5HL	7500	97.2	98.0
YbF_3	0.5H) ⁸			
$ZnSe/YbF_{3}$	(0.5HL0.5H) ⁶ 0.8(0.5HL0.5H) ⁷ 0.64(0.5HL	13600	98.5	98.0
	0.5H) ⁷ 0.51(0.5HL0.5H) ⁶			

3 制备和测试

制备该分色片的关键是严格控制镀膜工艺,降 低 Ge 在近红外区的吸收。薄膜的制作是在成都南 光机器有限公司生产的 DM-700 型镀膜机上完成 的,基板为直径 60 mm 的 ZnSe。镀制的关键是沉 积温度和薄膜厚度的控制。由于 ZnSe 的特性对沉 积温度很敏感^[11],基板温度不能选的太高,但太低 又会影响薄膜的牢固度,故选择基板温度为 230 °C, 沉积速率为 1 nm/s。厚度控制既可采用光学监控, 也可通过 MDC-360 石英晶振控制仪控制。基板的 另一面镀上相应的长波红外减反射膜(45°入射)。

除光学性能外,薄膜的牢固度和环境稳定性也 是红外薄膜的主要考察指标。为提高薄膜的牢固 性,必须考虑薄膜材料间的应力匹配问题。薄膜应 力受多个因素影响,其中沉积温度是一个主要的控 制因素。图 3 和图 4 分别为实验测得的 ZnSe 基板 上沉积的 ZnSe 和 YbF。两种材料应力随温度变化 的关系,沉积速率均为 1 nm/s。由图可知,ZnSe 呈 现压应力,而 YbF。为张应力,Ge 的应力特性与 ZnSe 类似。为了选择合适的沉积温度,需要同时考 虑 YbF₃和 ZnSe 这两种薄膜的应力特点,并且兼顾 光学特性。对于 YbF₃来说,为了提高薄膜聚集密 度,减少水吸收带的影响,需要选择较高的沉积温 度,但是对于ZnSe来说,当沉积温度超过230℃,



图 3 ZnSe 薄膜应力随沉积温度变化的关系 Fig. 3 Measured total stress of ZnSe films versus deposition temperature





成膜概率降低^[12],反蒸发严重,不利于 ZnSe 薄膜生 长。综合以上特点,选择沉积温度为 230 ℃,这时 YbF₃ 与 ZnSe 应力基本匹配,有利于应力的减小。

短波红外波长的反射率在 PE 公司的 λ 900 分 光光度计进行,以 45°入射角测试,以新鲜镀制的银 膜作为反射基准,测试曲线如图 5 所示。考虑银反 射镜的实际反射率后,1.0~2.3 μ m 波长的实测反 射率约为 96.2%,与设计值接近。长波红外的透射 率测试在傅里叶红外光谱仪上完成。图 6 为 45°实 测透射光谱,长波红外区的平均透射率为 93.2%。 和图 2 设计曲线相比,需要注意的是 11 μ m 以后, 吸收逐渐增大,这可能是由于 YbF₃ 材料不够致密, 水气吸附导致的吸收缘故。





对所研制的分色片进行环境实验,分别通过了胶 带纸快速撕拉,温度实验(在-40±2 ℃和 60±2 ℃ 的温度中各保持 2 h)和湿热实验(在温度为 45± 2 ℃,相对湿度为 95%的条件下连续放置 24 h),膜层 均无脱落、起泡和龟裂现象,且分色片的反射率和透 射率没有下降。





Fig. 6 Measured transmittance of beam splitter in the longwave infrared region (45° incidence, antireflective coating was coated on other surface)

4 结 论

在 ZnSe 基板上设计了反射短波红外、透射长 波红外的分色片,通过多次实验,膜层的光学特性达 到了光学系统的要求并且可经受环境实验的要求, 已应用在系统中并取得了良好的效果,为以后工程 项目红外光学系统的分色片的批量制备打下了良好 的技术基础。

参考文献

- Ma Xiaoyu, Fan Zhihua, Rao Changhui *et al.*. Application of Hartmann-Shack sensor in optical readout system of uncooled infrared imaging[J]. *Acta Optica Sinica*, 2009, **29**(2): 490~495
 马晓燠,樊志华,饶长辉等. 基于哈特曼波前传感器的非制冷红 外成像光学读出系统[J]. 光学学报, 2009, **29**(2): 490~495
- 2 Xu Liang, Zhang Guoyu, Gao Yujun et al.. Design of 8 × uncooled thermal infrared hybrid refractive-diffractive continuous-zoom lenses[J]. Acta Optica Sinica, 2009, 29(2): 478~481
 徐 亮,张国玉,高玉军等. 8 倍非制冷型红外折/衍射连续变 焦系统设计[J]. 光学学报, 2009, 29(2): 478~481
- 3 Lin Bing, Yu Tianyan, Liu Dingquan *et al.*. Design and deposition of infrared/visible wideband color separation fiters[J].
 J. Infrared and Millimeter Wave, 2004, 23(5): 393~395
 林 炳,于天燕,刘定权等. 红外/可见光宽带分色片设计与制备[J]. 红外与毫米波学报, 2004, 23(5): 393~395
- 4 F. Lemarquis, G. Marchand, C. Amra. Design and manufacture of low-absorption ZnS-YF₃ antireflection coatings in the 3.5~16 mm spectral range [J]. Appl. Opt., 1998, 37(19): 4239~4244
- 5 Yu Tianyan, Zhu Furong, Liu Dingquan *et al.*. Design and deposition of broadband IR antireflection coatings on ZnS lenses [J]. *Acta Optica Sinica*, 2005, **25**(2): 270~273 于天燕,朱福荣,刘定权等. 硫化锌透镜中长波红外宽带增透膜的研制[J]. 光学学报, 2005, **25**(2): 270~273
- 6 D. F. Bezuidenhout, K. D. Clarke, R. Pretorius. The optical properties of YF3 films [J]. Thin Solid Films, 1987, 155: $17{\sim}30$
- 7 Ying Wang, Yueguang Zhang, Weilan Chen *et al.*. Optical properties and residual stress of YbF₃ thin films deposited at different temperatures [J]. *Appl. Opt.*, 2008, **47** (13): c319~c323

- 8 Frederic Lemarquis, Gérard Marchand, Claude Amra et al.. Infrared optical filters for the infrared atmospheric sounding interferometer meteorological space instrument[J]. Appl. Opt., 1999, 38(19): 4182~4188
- 9 Ronald A. ferrante, Timothy W. Rand, Robert Cabrera et al.. Visible/long-wave infrared dichroic beamsplitter [J]. Opt. Engng., 2005, 44(6): 063801-4
- 10 Tang Jinfa, Gu Peifu. Optical Thin Film and Technology[M].

Beijing: China Machine Press, 1989. 75~76 唐晋发,顾培夫[M]. 薄膜光学与技术. 北京: 机械工业出版社, 1989. 75~76

- 11 H. R. Dobler. Infrared coatings [J]. Appl. Opt., 1989, 28(14): 2698~2701
- 12 Elmar Ritter. Optical film material and their applications [J]. *Appl. Opt.*, 1976, **15**(10): 2318~2327

《中国激光》"全固态激光技术"专题 征稿启事

全固态激光技术是目前我国在国际上为数不多的从材料源头到激光系统集成拥有整体优势的高技术领 域之一,全固态激光器件与材料研究的迅速发展,对激光先进制造技术、激光显示技术和激光医疗等领域的 发展产生了巨大的推动作用,已取得大量研究成果。《中国激光》已于 2009 年 7 月出版"全固态激光技术" 专集,得到了本领域很多院士和知名专家的大力支持,发表了多篇国内知名课题组的全固态激光技术发展前 沿领域的文章,反响非常好。应广大专家、作者和读者的要求,《中国激光》计划于 2010 年 7 月继续推出"全 固态激光技术"专题栏目,现特向国内外广大研究人员征集"全固态激光技术"方面原创性的研究论文和综 述,旨在集中反映该方面最新的研究成果及研究进展。

征稿范围包括:

- ·连续全固态激光器;
- ・脉冲全固态激光器;
- ·光纤激光器;
- ・其他

截稿日期:2010年4月15日

投稿方式以及格式:可通过中国光学期刊网网上投稿系统直接上传稿件(主题标明"全固态激光技术" 投稿),详情请参见 http://www.opticsjournal.net/zgjg.htm。本专题投稿文体不限,中英文皆可,其电子 版请使用 MS-word 格式,有任何问题请咨询马沂编辑,E-mail: CJL@siom.ac.cn;电话:021-69918427。

《中国激光》编辑部